

日本信頼性学会
第30回秋季信頼性シンポジウム
プログラム

2017年10月27日現在（敬称略）

日時：2017年11月27日（月）10：00～19：00

場所：一般財団法人日本科学技術連盟 東高円寺ビル

	第1会場（2階講堂）	第2会場（3階A室）
10：00～10：10	会長挨拶 金川 信康 会長	
10：10～11：40	特別講演：自動運転の進展とその評価 水間 毅 氏（東京大学大学院 特任教授） 司会：島添 敏之 氏（（株）京三製作所）	
11：40～13：00	昼 食	
	セッション1 （試験、故障解析、部品、要素技術の信頼性） 司会：島添敏之の（株）京三製作所	セッション4 （データ収集、解析） 司会：高橋 聖（日本大学）
13：00～13：25	α 線照射によるメモリのソフトエラー試験 ○伊藤和幸（沖エンジニアリング（株））	ペーパーレス時代の電子データにおける手書き署名の筆跡鑑定 ○内村俊二（第一工業大学），村岡哲也（第一工業大学），池田弘明（コンサルタント）
13：25～13：50	HALTにおけるストレスの効果 その3 従来信頼性試験との比較 ○Raphael PIHET，平田拓哉，河合秀己，青木雄一（エスベック（株））	曇り込みニューラルネットワークを用いた設備特性劣化のオンラインモニタリングデータ分析 ○横澤成望，横川慎二（電気通信大学）
13：50～14：15	X線透視観察における単体FETの損傷評価 ○芝野照夫（三菱電機（株））	踏切歩行者の侵入または停止判断に関する実験結果（1） ○畠山 直，鎌木俊暁，村越暁子，宮地由芽子（（公財）鉄道総合技術研究所）
14：15～14：40	時間と数の壁を打ち破る二段階設計—信頼と安全を設計する— ○長谷部光雄（のっぽ技研），柴田義文（安信経営工学研究所）	自動車旅客輸送業事故情報の定量的解析 ○関田隆一（福山大学）
14：40～14：50	休 憩	休 憩
	セッション2 （試験、故障解析、部品） 司会：横川慎二（電気通信大学）	セッション5 （安全性、リスク、理論） 司会：石田 勉（元 日本アイ・ピー・エム株）
14：50～15：15	複合パワーサイクル試験による製品の弱点早期検出 ○石津勝之（（株）村田製作所），西川弘晃（（株）金沢村田製作所）	原理的安全の提案 ○柴田義文（安信経営工学研究所），長谷部光雄（のっぽ技研），松岡敏成（機能の安定性と安全の研究会）
15：15～15：40	電位コントラスト法を用いた絶縁劣化個所の故障解析技術 ○斎藤 彰（（株）村田製作所）	リスク評価のための故障率目標に関する考察 ○松岡敏成，柴田義文，長谷部光雄，原田文明（機能の安定性と安全の研究会）
15：40～16：05	結露サイクル試験を用いたAgのエレクトロケミカルマイグレーションの評価 ○仙波孝彬，石津勝之，藤澤孝文（（株）村田製作所）	ポアソン分布は二項分布の派生物とは限らない ○藤川忠重（元松下通信工業（株））
16：05～16：15	休 憩	休 憩
	セッション3 （故障物性研究会） 司会：土屋英晴（（株）クオルテック）	セッション6 （システムの信頼性、保全性） 司会：岩田浩司（（公財）鉄道総合技術研究所）
16：15～16：40	Sn-Cu系はんだ接合界面の200℃下におけるエレクトロマイグレーション現象 ○大矢怜史，小柴悠資，木原誠一郎，池本 裕，新子比呂志（（株）クオルテック）	テキストマイニングと機能共鳴分析法を用いた自動車のリコール情報の分析 ○横川慎二，國井喬介（電気通信大学）
16：40～17：05	ポイドによるはんだクラックへの影響に関する研究 ○山田智敬（レシップ電子（株）），安達昭司（（株）ユニハイトシステム）	鉄道沿線信号設備における電子機器の使用環境把握に関する検討 ○藤田浩由，野村拓也，竜本ジョ，新井英樹（（公財）鉄道総合技術研究所）
17：05～17：30	電子部品の硫化と原因材料の特定 ○高貴智久（沖エンジニアリング（株））	軌道回路の状態基準保全に向けた検討（その3）—設備故障の再現試験とマハラノビス距離による設備の劣化把握— ○志田 洋（西日本旅客鉄道（株）），二宮 崇（愛媛大学大学院），高橋 寛（愛媛大学大学院）
17：40～19：00	情報交換会（5階研修室）	

* ○印は発表者です。発表タイトルの変更は報文集にて修正いたします。各セッションの司会は変更する場合がございます。